## X線異常散乱測定による赤外線光ファイバーガラス材料の 原子配列の研究

細川 伸也

熊本大学大学院先端科学研究部 (理学系)

As・Se 系ガラスは赤外線光ファイバーの原料として知られている。多元系機能性ガ ラスの原子配列について、元素ごとの部分構造を求めるために、九州シンクロトロン 光研究センターでX線異常散乱実験の新しい手法を開発した。ほぼ同じエネルギー分 解能を持つ2つのシリコン・ドリフト検出器を準備し、一方は角度を変化させて散乱 X線強度を測定し、そのシグナルに含まれる蛍光X線やコンプトン散乱成分を除去す るために、もう一方の検出器を後方散乱位置に固定した。この方法により、入射X線 エネルギーを組成元素の吸収端付近で変化させたときの散乱X線強度のコントラスト (差構造因子)について、大幅な解析時間の短縮と測定精度の改善を行うことができ た。本稿では、As・Se 系赤外線ガラスファイバー材料の、九州シンクロトロン光研究 センターで行った As K吸収端付近の測定結果、ESRF で行った Se K吸収端付近の結 果、および J・PARC で行った相補的な中性子回折実験の結果を全て取り入れた逆モン テ・カルロ計算による As・Se ガラスの部分原子配列の結果を報告する。



## Local- and intermediate-range local structures of As-Se glasses in a wide concentration region including the stiffness transition



S. Hosokawa,<sup>1</sup> J. R. Stellhorn,<sup>2</sup> E. Magome,<sup>3</sup> P. Boolchand,<sup>4</sup> K. Ikeda,<sup>5</sup> and T. Otomo<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Kumamoto Univ., Japan, <sup>2</sup>Hiroshima Univ., Japan, <sup>3</sup>Saga Light Source, Japan, <sup>4</sup>Univ. Sincinatti, USA, <sup>5</sup>KEK, Japan

